



para resolver los problemas que surjan durante el montaje.<br />  
&bull;&nbsp;Valoraci&ocute;n de la memoria final:  
comparaci&ocute;n teor&iacute;a-resultados experimentales,  
presentaci&ocute;n del trabajo, puntualidad en su entrega.<br />  
&bull;&nbsp;Se puntuar&aacute; entre cero y dos puntos que se  
sumar&aacute;n a la nota del examen de problemas.</p>  
<p><strong>BIBLIOGRAF&iacute;a.</strong><br />  
&bull;&nbsp;Sedra-Smith: Microelectronic circuits, Oxford University Press,  
1998<br /> &bull;&nbsp;P.R.Gray, R.G. Meyer: Analysis and Design of  
Analog Integrated Circuits, 3&ordf; Ed., Ed. John Wiley & sons,  
1993</p> <p>&bull;&nbsp;L&ocute;pez Villanueva, J.A.,  
Jim&eacute;nez Tejada, J.A., &quot;Fundamentos de Teor&iacute;a de  
Circuitos para Electr&ocute;nica&quot;<br />  
&bull;&nbsp;Jim&eacute;nez Tejada, J.A., L&ocute;pez Villanueva,  
J.A., &quot;Problemas de Electr&ocute;nica  
B&aacute;sica&quot;<br /> &nbsp;</p>